

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
«Дифракционные методы исследования наноструктур»

Направление подготовки 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Профиль Метрология наноструктур и нанотехнологий

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2018

Цель изучения дисциплины:

формирование у студентов компетенций, связанных с пониманием природы и закономерностей физических процессов, на которых основаны дифракционные методы исследования наноструктур

Задачи изучения дисциплины:

теоретическое и практическое освоение дифракционных методов исследования наноструктур; выработка у будущего специалиста комплекса навыков и знаний для использования основных дифракционных методов анализа в физике конденсированного состояния как в области исследования структуры материалов, так и для контроля качества материалов

Перечень формируемых компетенций:

ПВК-9 - способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи, проводит научные эксперименты, оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с принятыми моделями для проверки их адекватности и при необходимости предлагать новые решения

ПК-29 - готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического регулирования и управления качеством

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет